

量子ビームによる表面物性・構造解析の新展開

New developments of surface properties
and structural analysis by quantum beams

物質の特性はその表面の構造や電子状態によって大きく変化するためそれらを把握することは重要である。表面分野における研究では量子ビームをプローブとした測定手法が多く利用されており、さらに、装置の高度化によりこれまで測定が困難であった溶液や大気圧環境下での測定が可能になり詳細な物性や反応機構を調べるのが可能になってきている。本シンポジウムでは量子ビームを用いた研究報告を通して、その有用性や将来展望について議論する。

日時：2020年3月13日(金) 13:30～17:00(予定)

会場：上智大学・四谷キャンパス

招待講演（敬称略、五十音順、仮題）

- ・倉橋光紀（NIMS）
「スピン・回転状態選別O₂、H₂分子ビームの生成と表面反応計測への応用」
- ・白澤徹郎（産総研）
「高速X線CTR散乱測定による界面現象のライブ観察」
- ・高木康多（JASRI）
「大気圧光電子分光装置を用いたガス雰囲気下試料の物性・構造解析」
- ・田口昇（産総研）
「Li分析における電子顕微鏡の活用」
- ・星野靖（神奈川大）
「イオンビームによる薄膜・表面の構造組成分析」
- ・堀場弘司（KEK）
「ナノ集光光電子分光による固体デバイスのオペランド電子状態解析」

一般公演数件募集

世話人：光原圭（立命館大）、吉越章隆（原子力機構）、服部梓（阪大）
問合せ先：k-mitsu@se.ritsumeai.ac.jp（順不同）